

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

VĚDECKO-TECHNICKÝ ČASOPIS
ROČNÍK 50 3/2005

OBSAH

<i>Vzpomínky na začátky časopisu JMO před padesáti lety</i> (L. Slavkovský)	71
<i>Měření mechanického napětí v tenkých vrstvách pomocí kombinované optické metody</i> (I. Ohlídal, M. Ohlídal, D. Franta, V. Čudek, V. Buršíková, M. Šíler)	72
<i>Analýza priečného profilu laserového zväzku transformovaného šošovkou</i> (J. Guttenová, P. Vojtek)	76
<i>Rastrovací elektronový mikroskop pro studium povrchů</i> (P. Hrnčířik, I. Müllerová)	79
<i>Zobrazení nevodivého vzorku v rastrovacím elektronovém mikroskopu</i> (F. Mika, L. Frank)	82
<i>Oznámení</i>	84
<i>Bezkontaktní měření malé deformace předmětu pomocí metody korelace polí koherenční zrnitosti</i> (P. Horváth, P. Šmíd, P. Wagnerová, M. Hrabovský)	85
<i>Meranie kriviek svietivosti</i> (P. Horňák)	91
<i>Největší technický veletrh (jpe)</i>	94
<i>Veletrh obalů pro všechny výrobky (jpe)</i>	94
<i>Intronix</i>	95
<i>SPIE/CS - The International Society for Optical Engineering/Czech and Slovak Chapter informuje</i>	96
<i>Nabídka sborníků SPIE/CS</i>	96
<i>Elektronika se profiluje na MSV</i>	97
<i>MACH 2005 PRAHA</i> (H. Pokorná)	98
<i>Mezinárodní veletrhy VISION - CREATIVE - INTEC</i> (L. Náhlíková)	99
<i>Z technické knihovny</i> (I. Brezina)	95, 100

Obsah časopisu Jemná mechanika a optika je uveden na internetu: <http://www.meopta.cz/jmo>

Informace o předplatném podá, objednávky přijímá, objednávky do zahraničí vyřizuje: SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc, tel.: 585 223 936, fax: 585 631 531.

Cena čísla 40 Kč včetně DPH

FINE MECHANICS AND OPTICS

SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL
VOLUME 50 3/2005

CONTENTS

<i>Remembering the beginnings of the journal JMO fifty years ago</i> (L. Slavkovský)	71
<i>Stress measurement in thin layers with aid of combined optical method</i> (I. Ohlídal, M. Ohlídal, D. Franta, V. Čudek, V. Buršíková, M. Šíler)	72
<i>Measuring of spatial characteristics of laser beams by using CCD camera</i> (J. Guttenová, P. Vojtek)	76
<i>Scanning electron microscope for surface study</i> (P. Hrnčířik, I. Müllerová)	79
<i>Imaging of nonconductive samples in a scanning electron microscope</i> (F. Mika, L. Frank)	82
<i>Non-contact measurement of small deformation of an object by means of the speckle correlation method</i> (P. Horváth, P. Šmíd, P. Wagnerová, M. Hrabovský)	85
<i>Measurement of luminosity curves</i> (P. Horňák)	91
<i>The largest technical fair (jpe)</i>	94
<i>Fair for all products packaging (jpe)</i>	94
<i>Intronix</i>	95
<i>SPIE/CS - The International Society for Optical Engineering/Czech and Slovak Chapter informs</i>	96
<i>SPIE/CS Proceedings offer</i>	96
<i>Electronics demonstrates itself at the International Engineering Fair in Brno</i>	97
<i>Mach 2005 Praha</i> (H. Pokorná)	98
<i>International fairs VISION - CREATIVE - INTEC</i> (L. Náhlíková)	99

You can also find the contents of the Journal on Internet: <http://www.Meopta.cz/jmo>

Information on subscription rate and on ordering gives the SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc, tel.: 585 223 936, fax: 585 631 531.

Price for single copy: 40 Kč incl. VAT